

# ご利用の装置と登録必須ファイル

Device in use and required registration files

装置名 Device registration name	大気中原子間力顕微鏡 AFM
装置ID Local ID	JI-012
大分類 Major category	走査型顕微鏡 Scanning Microscope
メーカー名 Manufacturer name	日立ハイテクサイエンス Hitach High-Tech Science
型番 Model number	AFM5000II SPA-400



## 登録必須ファイル Required registration files

**運用版 (Deployed Version)**  
.xqdx ファイル (画像ファイル/測定条件)  
.xqdx file (Image File/Measurement Conditions)

**異常終了と表示されたら**  
If “Abnormal termination” is displayed



**登録必須ファイルであるか確認してください。**

Please confirm whether it is a required registration file

それでも解消されない場合は、DICEお問い合わせフォームより問い合わせください。

If the issue persists, please contact us through the DICE Inquiry Form

## 機器利用の際のお約束について

Terms of use for equipment

**1 成果を論文やプレスリリースで発表する場合は謝辞をご記載ください。**

When you publish results in a paper or press release, please include acknowledgments

**2 課題利用が終わったら利用報告書をご提出ください。**

Please submit a user report after completing your project

詳細は以下からご確認ください

For more details, please check below

謝辞について

About acknowledgments

<https://nanonet.go.jp/page/page000731.html>



利用報告書について

About user report

<https://nanonet.go.jp/page/page000846.html>